

JEOL JMS-T100GCv

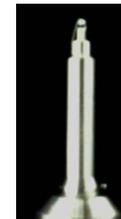
飛行時間型質量分析計



DIP

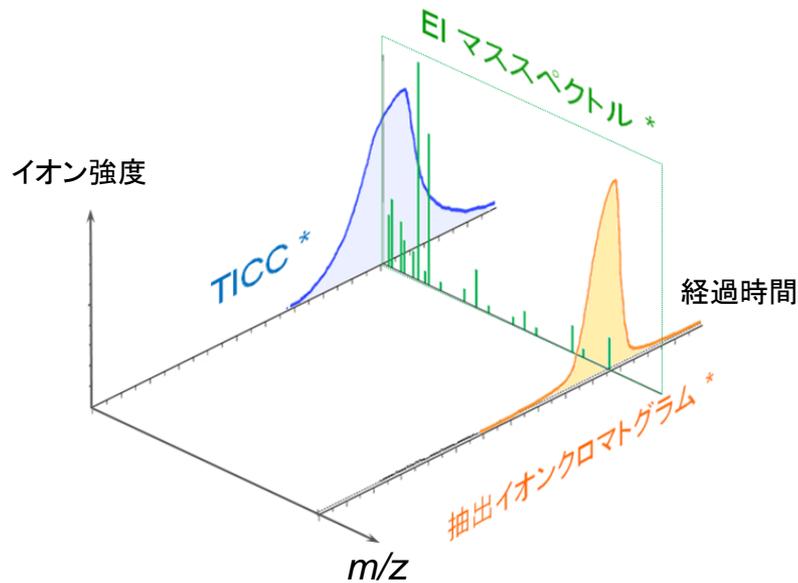


DEP



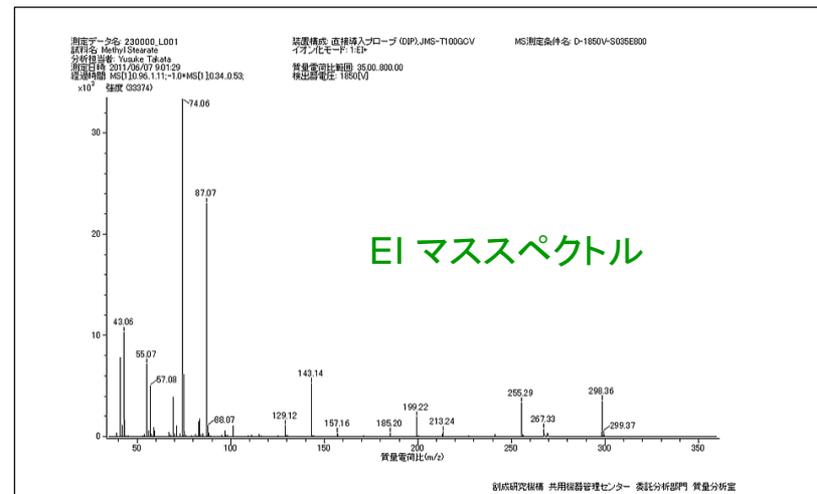
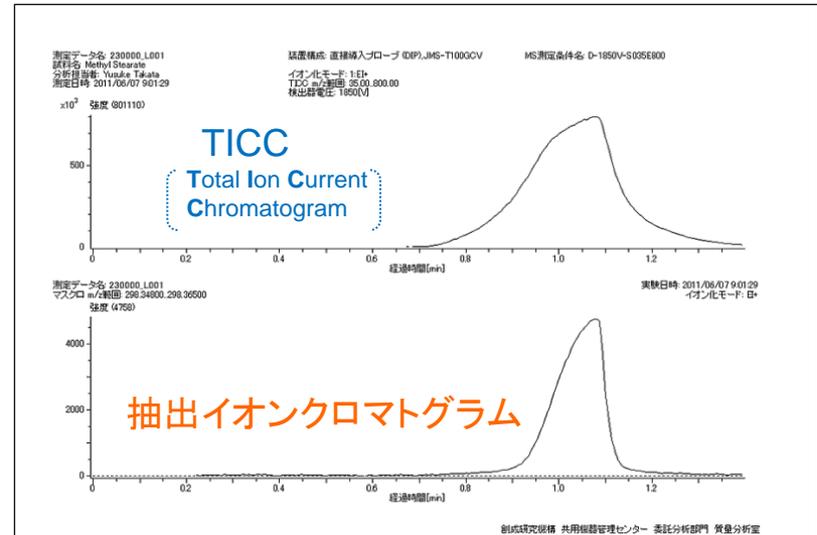
対応イオン化法	EI, FD, FI
導入方法	直接, GC
使用プローブ	DIP, DEP, FD
通常測定質量範囲	$m/z \sim 800$
設定分解能	6,000 ($m/z 617$, 半値幅)
質量精度	< 5ppm または 2 μ (外部標準)

返却データ様式 (スペクトル測定結果)

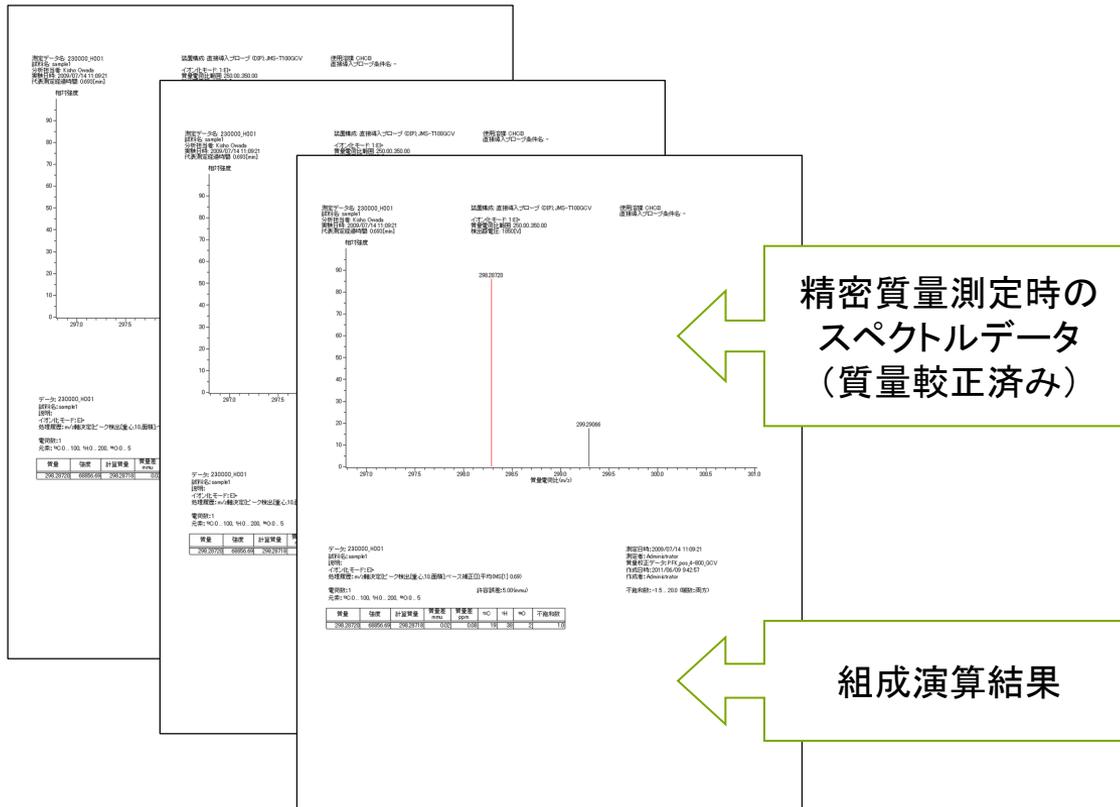


* :用語は日本質量分析学会編「マススペクトロメトリー関係用語集 第3版」にのっとっています。詳細はこちらをご覧ください。

→ <http://www.mssj.jp/index-jp.html>



返却データ様式 (精密質量測定結果)



3枚で一組(任意の3点のデータを抽出)

ヘッダーの読み方

測定データ名: 230000-L00 (1)

試料名: Methyl Stearate
分析担当者: Yusuke Takata
実験日時: 2011/06/07 9:01:29
代表測定経過時間: 0.693[min]

装置構成: 直接導入プローブ (DIP) JMS-T100GCV (2)

イオン化モード: 1:E+ (3)
質量電荷比範囲: 35.00.800.00
使用溶媒: CHCl₃

直接導入プローブ条件名: DIP230-256up (4)

検出器電圧: 1850[V]

(1) 測定データ名の表記

- ① 受付番号
- ② L: スペクトル測定, H: 精密質量測定
- ③ 測定回数

230000-L001
① ② ③

(2) 装置構成の表記

- ① 導入方法の種別
(導入方法・プローブ・イオン化法の組み合わせによって表記が異なる、右表参照)
- ② 機種名

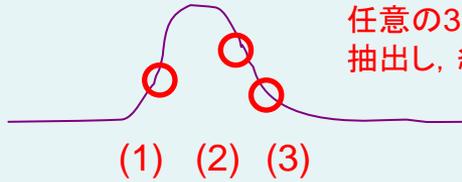
装置構成の表記		導入方法	使用プローブ	イオン化法
直接導入プローブ(DIP)	JMS-T100GCV	直接	DIP	EI
直接導入プローブ	JMS-T100GCV		DEP	
FDプローブ	JMS-T100GCV	GC	FD	FI
	JMS-T100GCV		(なし)	EI

① ② ③

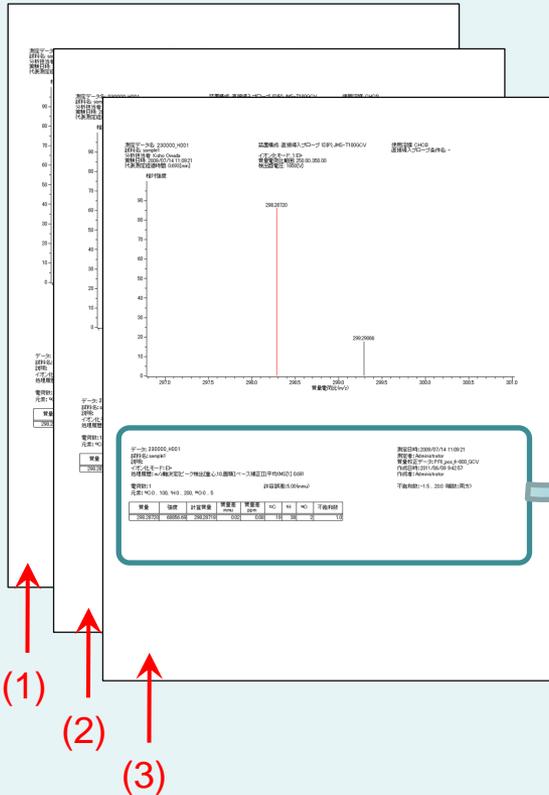
(3) イオン化法の表記

(4) 測定条件等の表記

データの読み方 (精密質量測定結果) T100GCv, T100LP共通



任意の3点の質量較正済みデータを抽出し、組成演算を行います。



① データ: 230000_H001
試料名: sample1
説明:
イオン化モード: EI+
処理履歴: m/z軸決定ピーク検出[重心,10,面積]ペー

② 平均(MS[1]) 0.69
許容誤差: 5.00(mru)

③ 測定日時: 2009/07/14 11:09:21
測定者: Administrator
質量校正データ: PFK_pos_4-800_GCV
作成日時: 2011/06/09 9:42:57
作成者: Administrator
不飽和数: -1.5 .. 20.0 (端数: 両方)

質量	強度	計算質量	質量差 mru	質量差 ppm	¹² C	¹ H	¹⁶ O	不飽和数
298.28720	68856.69	298.28718	0.02	0.08	19	38	2	1.0



- ① 含有元素組成の指定.
- ② 許容誤差範囲を設定.
- ③ 化合物の不飽和度を設定.